

日本信頼性学会
第25回春季信頼性シンポジウムプログラム

日時：2017年5月31日（水）10：30～19：20
場所：一般財団法人日本科学技術連盟 本部（西新宿）

2017.4.18.現在
(敬称略)

	第1会場 (Room-A)	第2会場 (Room-C)
10：30～12：00	第39回年次総会	-
12：00～13：00	昼食	昼食
13：00～14：30	特別講演 「MULTI-STATE NETWORK RELIABILITY EVALUATION」 Professor Ming J Zuo (University of Alberta, Canada)	
14：30～14：40	休憩	休憩
	セッション1 (試験, 故障解析, 部品, 要素技術の信頼性, ハードウェア面) 司会：土屋英晴 (信頼性コンサルタント)	セッション3 (日本OR学会・システム信頼性研究部会 オーガナイズドセッション) 司会：木村光宏 (法政大学)
14：40～15：05	故障までの時間の分布に関する考察-2(検査と信頼性) 松岡敏成, 長谷川光雄, 柴田義文 (機能の安定性と安全の研究会)	A note on a statistical detection method of cascading failure for parallel systems 太田修平 (法政大学大学院), 木村光宏 (法政大学)
15：05～15：30	短周期テストパターンを用いた超微細VLSI高信頼化のための遅延解析, 劣化対策 加藤健太郎 (鶴岡工業高等専門学校)	Conditions for the optimal arrangement of a connected-(m-1, s)-out-of-(m, n): F lattice system 中村太信 (首都大学東京), 山本久志 (首都大学東京), 松尾さやか (首都大学東京), 肖霄 (首都大学東京), 秋葉知昭 (千葉工業大学)
15：30～15：55	HALTにおけるストレスの効果その2 振動試験結果の温度依存性 Raphael Pihet (エスペック(株)), 平田拓哉 (エスペック(株)), 青木雄一 (エスペック(株))	Compromised life test plan for accelerated degradation test of three stress levels Takenori SAKUMURA (中央大学)
15：55～16：20	高性能サーモグラフィの分解能及び事例の紹介 中川 渉 (日本バーンズ(株)), 松本 諭 (日本バーンズ(株)), 土屋英晴 (信頼性コンサルタント)	Analysis for the Conditions of Component Assignment for the Optimal Arrangement of a k-Window System 秋葉知昭 (千葉工業大学)
16：20～16：30	休憩	休憩
	セッション2 (システムの信頼性, 保全性, ライフサイクルおよびデータ収集, 解析) 司会：岩田浩司 (公益財団法人鉄道総合技術研究所)	セッション4 (安全性, リスクおよび理論, 一般) 司会：島添敏之 (株式会社京三製作所)
16：30～16：55	Life Cycle Costing の研究におけるIntegrated logistic support 検討の有用性-Lcc研究会 研究成果報告 (1) - 中島洋行 (明星大学), 夏目 武 (元筑波技術短期大学), 門奈哲也 (サッポロビール), 古野紀雄 (日本電気)	日本信頼性学会 要素技術安全研究会2016年度活動報告 機械類の機能安全・停止制御に係る国際規格と作動要求モードとに関する考察 川島 興 (オリエンタルモーター(株)), 佐藤吉信 ((株)日本環境認証機構)
16：55～17：20	軌道回路の状態基準保全に向けた検討 (その2) - 機械学習による設備状態のトレンド分析 - 志田 洋 (西日本旅客鉄道(株)), 大串裕都 (西日本旅客鉄道(株)), 二宮 崇 (愛媛大学大学院), 高橋 寛 (愛媛大学大学院)	現行デペンダビリティと安全 柴田義文 (安信経営工学研究所), 長谷部光雄 (のっぽ技研), 松岡敏成 (三菱電機(株)), 原田文明 (富士ゼロックスアドバンステクノロジー(株))
17：20～17：45	Gaborフィルタの理論を応用した手書き漢字の形状とペン圧の濃淡とによる解析 内村俊二 (第一工業大学), 村岡哲也 (第一工業大学), 池田弘明 (コンサルタント)	
17：50～19：20	情報交換会	

*発表タイトルの変更は報文集にて訂正します。司会者は変更する場合があります。